

FE-EPMA (JXA-8530F) 利用申請書

申込日	202 年 月 日		受付番号	
	氏名	学科・所属研究室名	職名・学年	TEL
指導教官 (責任者)	ふりがな ()			
利用者	ふりがな ()			
MAIL				
利用日時	年 月 日 : ~ :			
試料名			蒸着	有 (C ・ Pt) / なし
測定の種類	ビーム径 (スキャンモード)	測定数・測定箇所 (図のみでも可)	測定条件(備考など)	
☐ SEM画像			倍率	
☐ 点分析	☐ 点		測定元素	全元素 / 特定元素 ()
	☐ 円 (μm)		半定量データ	あり / なし
☐ 線分析	高倍率 (×3000以上) / 30 μm以下			
	☐ 点		測定元素	
			ピクセル数	(デフォルト256)
	☐ 円 (μm)		倍率	
			低倍率 (×3000以下) / 30 μm以上 *ピクセル数とピクセルサイズで分析領域を指定	
	☐ 点		測定元素	
			分析範囲	μm
	☐ 円 (μm)		ピクセル数	(デフォルト256)
			ピクセルサイズ	μm (デフォルト1 μm)
			Dwell Time	ms (デフォルト500 ms)
☐ 面分析	高倍率 (×3000以上) *倍率で分析領域を指定 (観察領域も可 X:Y=4:3)			
	☐ 点		測定元素	
			分析範囲	μm
	☐ 円 (μm)		倍率	
			ピクセル数	(200-400程度) (デフォルト256×256)
			Dwell Time	ms (デフォルト5-50 ms)
	低倍率 (×3000以下) *ピクセル数とピクセルサイズで分析領域を指定			
	☐ 点		測定元素	
			分析範囲	μm
	☐ 円 (μm)		ピクセル数	(デフォルト200-400程度)
			ピクセルサイズ	μm (デフォルト1 μm)
			Dwell Time	ms (デフォルト5-50 ms)
	試料個数	個		

* 詳しい測定箇所については別紙で図示してください

* 利用料金は15分単位切り上げです。

* 使用可能時間は9:00-17:00